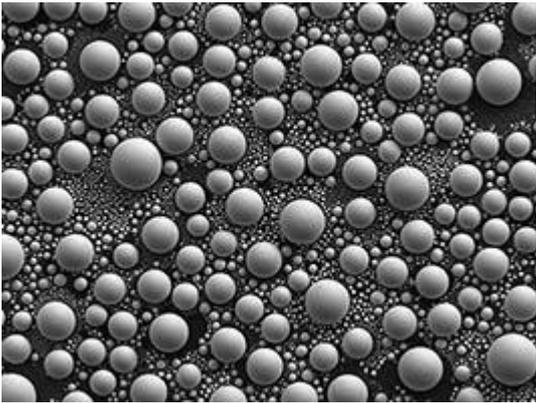


EM-TecSn カーボン基板上の Sn アイランド標準試料

面分解能標準試料は適した SEM スタブに取付けられます。



31-022100 EM-TecSn6 カーボン基板上の Sn アイランド標準試料 (5nm-30um)

EM-Tec Sn6 はカーボン基板上の Sn アイランドの標準試料です。

カーボン基盤上の Sn アイランドは、SEM、FESEM、FIB、CD-SEM、マイクロプローブ、オージェおよび SIMS システムの面分解能テストに適した標準試料です。様々なサイズのほぼ完全な丸い球は、画質、明るさとコントラスト(グレーレベル)、最適なプローブサイズと非点収差補正を決定するのに特に適しています。カーボン基盤上の Sn アイランドは SEM 内に金の導入に制限がある場合に使用されています。Sn アイランドの球形は、カーボン基盤上の金よりも認識しやすく、使いやすくなっています。しかしながら、全体の信号レベルは、カーボン基盤上の金のレベルよりも低くなります。Sn アイランドの解像度校正標準試料には以下の 2 種類のサイズがあります：

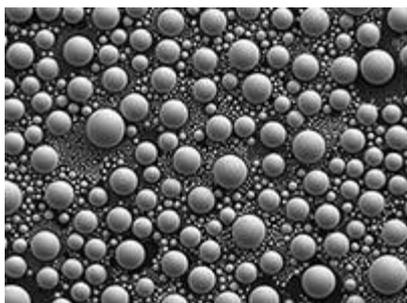
EM-Tec Sn6 は、5nm - 30 μ m 径のカーボン基板上的 Sn アイランドの標準試料です。この標準試料の解像度は、広範囲の倍率範囲をカバーし、約 100 倍の低倍率のから中倍率の範囲で有用です。また、より大きい Sn アイランドはより低い kV 範囲のために適しています。低倍率から高倍率にするに連れ、より小さな球体を選択し、拡大して電子ビームを調整します。

EM-Tec 7 は、10-100nm 径のカーボン基板上的 Sn アイランドの標準試料です。高精度の SEM と FESEM のための優れた試験片で、Sn アイランドの滑らかな径の層を備えています。×30,000 またはそれ以上の倍率の調整に適しています。

EM-Tec カーボン基板上的 Sn アイランド標準試料は、一般的な SEM スタブマウントタイプと単体(シート)が準備がされています。次の詳細情報より適した製品をお選び下さい。

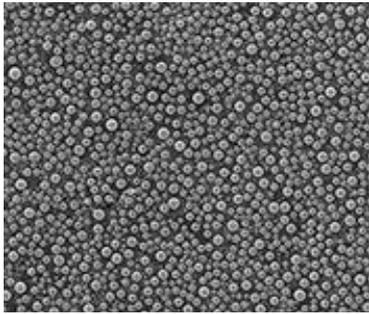
EMTec カーボン基板上の Sn アイランド標準試料

球状の Sn アイランド径の範囲は 5nm~30um です。また、カーボン基板のサイズは直径 6mm、高さ 2mm です。広範囲の球サイズのため、この試験片は、広範囲の倍率および加速電圧の調整に理想的です。100 倍の低倍率から使用でき、より高倍率用により小さい径の Sn 球が利用可能です。ほぼ完全な球体は、標準 SEM での解像度テストに理想的です。倍率 15,000 倍以上で使用可能です。標準 SEM、テーブルトップ SEM、のための使いやすい分解能標本としてもご利用いただけます。フィラメント交換後の性能テストなど、SEM を最適化する優れた標準試料です。標準的な SEM スタブにマウントされたタイプと単独(シート)タイプが用意されています。複数の SEM でこの標準試料を使用する場合は、SEM スタブアダプターにより使用可能になります。



EM-Tec Sn6 カーボン基板上の Sn アイランドの標準試料
5nm-30um

パーツ番号	内容及び数量	価格
31-022100-U	シートタイプ 1個	¥56,000
31-022100-1	Ø12.7mm F 標準ピンスタブ 1個	¥59,000
31-022100-2	Ø12.7mm Z 標準ピンスタブ 1個	¥59,000
31-022100-6	Ø12.2mm シリンダースタブ 1個	¥59,000
31-022100-8	Ø 15mm M4 スタブ 1個	¥59,000



EM-Tec Sn7 カーボン基板上の Sn アイランドの標準試料
on 10-100nm

パーツ番号	内容 及び 数量	価 格
31-022300-U	シートタイプ 1 個	¥43,000
31-022300-1	Ø12.7mm F 標準ピンスタブ 1 個	¥46,000
31-022300-2	Ø12.7mm Z 標準ピンスタブ 1 個	¥46,000
31-022300-6	Ø12.2mm シリンダースタブ 1 個	¥46,000
31-022300-8	Ø 15mm M4 スタブ 1 個	¥46,000

備考：本内容は予告なしに変更されることがございます。

 エルミネット株式会社

〒124-0012 東京都葛飾区立石 3-15-4
TEL:03-6379-4105 FAX:03-6379-4106

www.elminet.co.jp EM-Tec Sn standard1612A